

SWIR Area scan Camera

SWIR 파장을 이용한 고속&고해상도 카메라

SWIR
Area scan
Camera

엔비전이 제안하는 SWIR Area Camera는 Sony IMX990 (SWIR)를 탑재하여, SWIR 파장대인 400 ~ 1700 nm 영역대의 검사가 가능한 카메라입니다.

반도체 웨이퍼 투과 검사를 비롯한 식품 분류 등 다양한 산업에서 활용할 수 있습니다.



Key Features

- 400 ~ 1700 nm 파장대 대응
- Sony IMX990 센서 사용
- C마운트 렌즈 사용을 통한 사용성 용이

Application

- Silicon water inspection
- Food sorting
- Industrial sorting
- Recycling
- Solar panel inspection

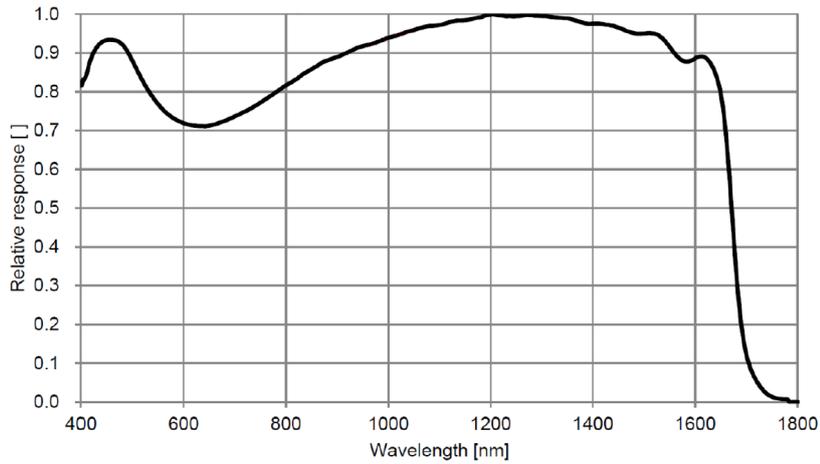
Specifications

Model	VCC-SXCXP1 SW
Image sensor	Sony IMX990 (SWIR)
Sensor type	1/2" Global shutter type Visible + SWIR
Effective pixel	1,296(H)×1,032(V): 1.3MP *3MP, 5MP 2024 Q3 출시 예정
Pixel pitch	5 μm(H)× 5 μm(V)
Interface	CoaXPress (CXP-3 x1)
Frame rate	117.87 fps (ClockSync mode) / 134.73 fps (LineSync mode) 13.52 fps (2x2 Pixel Shift), 3.38 fps (4x4 Pixel Shift) *8bits 기준
Resolution	Normal mode: 1,296 x 1,032 (1.34MP)
Power	DC+24V±5% (30m 이하 파워 케이블 사용 권장)
Consumption	5.0W [with pixel shifting]
Dimensions	H:65mm W:65mm D:95mm(excluding projection)
Weight	약 600g
Lens mount	C-mount

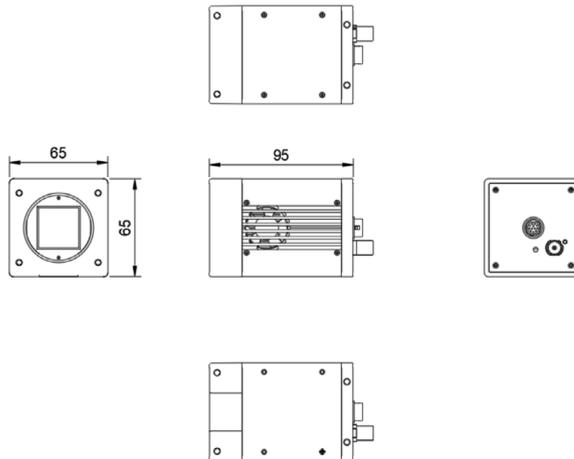
SWIR Area scan camera

SWIR 파장을 이용한 고속&고해상도 카메라

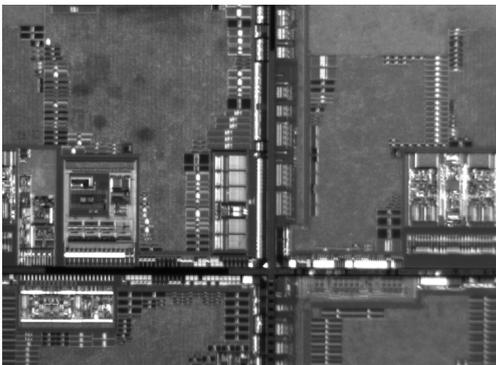
Spectral Response



Dimension



SWIR camera vs Mono camera 촬영 이미지 비교



< 1.3M SWIR 1x1 Image >
표면 이물 등 영향 제거



< 5M Mono Image >
표면 이물 등 영향 다수